



各 位

平成 25 年 11 月 29 日

会 社 名 日本電子材料株式会社
代 表 者 代表取締役社長 風間 悦男
(コード番号 6855 東証1部)
問 合 せ 先 取締役 管理部門統括部長 足立 安孝
電 話 06 (6482) 2007

平成 25 年度近畿地方発明表彰 地域協会会長賞受賞のお知らせ.

当社は、平成 25 年度近畿地方発明表彰式にて地域協会会長賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社が保有するプローブカードの複数の IC チップを同時に測定するシステムを具体化するに不可欠な技術が、技術的に優秀且つ実施効果の高い特許であると評価され、11 月 25 日に開催された、平成 25 年度近畿地方発明表彰式にて、地域協会会長賞を受賞しました。

地方発明表彰は、公益社団法人発明協会の主催により、大正 10 年よりはじまった顕彰です。「その発明が地域産業にいかに貢献しているのか」という観点から全国を 8 地方に分け、それぞれの地方から生まれた優れた技術を顕彰するものです。

当社は、半導体産業に一層の貢献を図るよう、今後も新たな技術開発に努めます。

<特許内容>

本特許の対象となった発明は、半導体ウエハー上の IC チップを複数個ずつ、同時に測定するプローブカードに関する提案です。

従来から、複数の IC チップを同時に測定することが行われていましたが、検査効率を高めるため、その方式は隣り合う IC チップを一群とするものが一般的でした。しかし、近年の半導体の高集積化に伴って、全てのプローブの電気的特性を均一にし、且つ高精度に位置決めを行うことがプローブカードに求められてきました。

本発明は、それらの要求に応え、複数の IC チップの測定対象領域を分散配置し、それぞれの測定対象領域を位置ずれの無いように対角線上に相互に結合することによって全ての問題を解消し、半導体メーカーの生産に寄与することができました。

この構造は、当社が国内において、2012 年に第 5152941 号として特許取得しております。

以 上